



Eq. 18



۱۳۸۲ / ۰۱ / ۳۰

مرکز اطلاعات مارک علی ایران  
تئیم مارک

## دانشگاه الزهرا دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  
رشته فیزیک حالت جامد

عنوان

شبیه‌سازی سطح سیلیکان متخلخل  
به روش DLA  
استاد راهنمای  
دکتر رضا ثابت داریانی

استاد مشاور

دکتر فرشاد ابراهیمی

دانشجو

سکینه مینائی فرد

اردیبهشت ۸۲

۱۴۹-۱۴

## فصل دوم

### مکانیک آماری و پدیده های تصادفی

۴۱

|    |   |
|----|---|
| ۴۲ | ۲-۱ مکانیک آماری                            |
| ۴۳ | ۲-۲ شرایط تعادل، عدم تعادل و نزدیک به تعادل |
| ۴۳ | ۲-۳ مبانی نظریه جنبشی در فرآیندهای انتقالی  |
| ۴۷ | ۲-۴ احتمال و توابع توزیع احتمال             |
| ۵۸ | ۲-۵ ولگشت یا گام های تصادفی                 |
| ۵۹ | ۲-۶ پدیده پخش                               |
| ۶۲ | ۲-۷ یکی از روشهای پیدا کردن ضریب پخش $D$    |
| ۶۳ | ۲-۸ فرآیند پخش در نیمه رساناهای             |
| ۶۷ | ۲-۹ پدیده های احتمالی و استوک استیکی        |

۷۱

### ساختارهای فراکتالی و مدل های رشد آماری

## فصل سوم

۷۲

### بخش اول: ساختارهای فراکتالی

۷۳

مقدمه

۷۵

#### ۳-۱-۱ فراکتال چیست؟

۸۲

۳-۱-۲ بررسی جنبه های معمول اشیاء فراکتالی

۸۸

۳-۱-۳ روشهایی در محاسبه بعد فراکتالی

۹۵

۳-۱-۴ فرآیند های انبوهشی و مدل های رشد

۱۱۲

### بخش دوم: بررسی مدل رشد DLA

۱۲۱

### شبیه سازی ساختار سیلیکان متخلخل با استفاده از روش DLA

## فصل چهارم

۱۲۴

### بخش اول: الگوریتم رشد در مدل DLA

۱۴۰

### بخش دوم: رشد ساختار سیلیکان متخلخل به کمک مدل DLA

### بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهاد

۱۵۴

پیوست ۱:

۱۵۸

پیوست ۲:

۱۶۵

پیوست ۳:

۱۶۷

پیوست ۴:

۱۶۹

پیوست ۵:

۱۷۱

پیوست ۶:

۱۷۴

پیوست ۷:

۱۷۶

۱۷۹

فهرست مراجع فارسی

۱۸۰

فهرست مراجع انگلیسی

## فهرست مطالب:

| صفحة | عنوان                                 |
|------|---------------------------------------|
| IV   | چکیده                                 |
| ۱    | فصل اول                               |
| ۲    | بخش اول: بررسی ساختار سیلیکان         |
| ۳    | مقدمه                                 |
| ۱۳   | ۱-۱-۱ ساختار سیلیکان                  |
| ۱۳   | ۱-۱-۱-۱ پیوند سیلیکان                 |
| ۱۴   | ۱-۱-۱-۲ نوارهای انرژی سیلیکان         |
| ۱۶   | ۱-۱-۱-۳ گاف انرژی در سیلیکان          |
| ۱۸   | ۱-۱-۱-۴ گذار غیر مستقیم در سیلیکان    |
| ۲۰   | ۱-۱-۱-۵ آلایش در سیلیکان              |
| ۲۲   | بخش دوم: بررسی ساختار سیلیکان متخلخل  |
| ۲۳   | مقدمه                                 |
| ۲۴   | ۱-۲ سیلیکان متخلخل چیست؟              |
| ۲۵   | ۱-۲-۲ ریخت شناسی خلل                  |
| ۲۵   | ۱-۲-۳ منحنی های جریان ولتاژ           |
| ۲۸   | ۱-۲-۴ اثر پتانسیل آندیزاسیون          |
| ۲۹   | ۱-۲-۵ اثر غلظت آلایش                  |
| ۳۰   | ۱-۲-۶ اثر جهت های بلور شناسی          |
| ۳۱   | ۱-۲-۷ اثر پیوندهای سطحی               |
| ۳۲   | ۱-۲-۸ شکل گیری سیلیکان متخلخل         |
| ۳۳   | ۱-۲-۹ مدل های شکل گیری سیلیکان متخلخل |
| ۳۸   | ۱-۲-۱۰ انواع ساختار متخلخل            |

## چکیده:

سیلیکان (Si) از جمله نیمه رساناهاای است که کاربرد وسیعی در صنعت الکترونیک دارد. اما همین عنصر به علت داشتن گاف غیر مستقیم، دارای خواص ضعیف اپتیکی بوده و جایگاهی در کاربردهای اپتیکی ندارد. یکی از راههایی که می توان بدان طریق در سیلیکان خواص اپتیکی بوجود آورد، کوچک کردن ساختار Si است، به حدی که اثرات کوانتمی در ساختار نواری آن بکار آید. به این ساختار، سیلیکان متخلخل (PS) گفته می شود. لایه های سیلیکان متخلخل معمولاً بوسیله آندیزاسیون الکتروشیمیایی سطح یک ویفر سیلیکان تهیه می شود.

در طی فرآیند آندیزاسیون ویفر سیلیکان، خلی در حجم سیلیکان ایجاد می شود که قطر آنها بنا به شرایط آندیزاسون در حد نانومتر یا میکرومتر است. این خلل در سطح یکی از صفحات بلورشناسی ( $100$ ) دارای ساختاری درختی و شاخه شاخه می باشد.

هدف این پایان نامه، شبیه سازی کامپیوترا این ساختار درختی که طی فرآیند متخلخل سازی (آندیزاسیون) در سیلیکان متخلخل ایجاد می شود ، توسط مدل رشد آماری (DLA) Diffusion-limited aggregation می باشد. مدل DLA یکی از مدلهای احتمالی و استوک-استیکی است که از پدیده پخش بر گرفته شده است. در این مدل با استفاده از ولگشت (Random-walk) ساختارهای فراکتالی از جمله کلاسترها غیر متراکم ساخته می شود.

بعد از شبیه سازی ساختار درختی سیلیکان متخلخل، با تغییراتی که در برنامه کامپیوترا خواهیم داد، سعی می کنیم تغییراتی که در شکل ساختار سیلیکان متخلخل در اثر تغییر بعضی از شرایط آندیزاسون (نوع ویفر سیلیکان زیرلایه و شدت جریان) بوجود می آید را شبیه سازی کنیم.

لازم به ذکر است که برای نوشتن برنامه کامپیوترا خوداژبان برنامه نویسی Fortran 90 استفاده کرده ایم.

## لغات کلیدی:

سیلیکان متخلخل – فراکتال – مدل رشد DLA – انبوهش پخش محدود –

گام های تصادفی

مرکز اطلاعات مارک عجمی زین  
تئیه مارک

# **فصل اول**

**ساختار شناسی سیلیکان و  
سیلیکان متفاہل**

**بخش اول:**

**بررسی ساختار سیلیکان**

## مقدمه :

همانطور که می‌دانیم جامدات از نظر آرایش بلوری به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول جامدات بلوری<sup>۱</sup>، دسته دوم جامدات چند بلوری یا نیمه بلوری<sup>۲</sup> و جامدات بی شکل<sup>۳</sup> می‌باشد.

یک جامد بلوری دارای این ویژگی است که اتم‌های تشکیل دهنده آن در شکلی تناوبی قرار گرفته‌اند که آرایش متناوب اتمی در یک بلور "شبکه" نامیده می‌شود [۱] در بین ۱۴ شبکه براوه (در فضای ۳ بعدی) ۳ شبکه مکعبی وجود دارد:

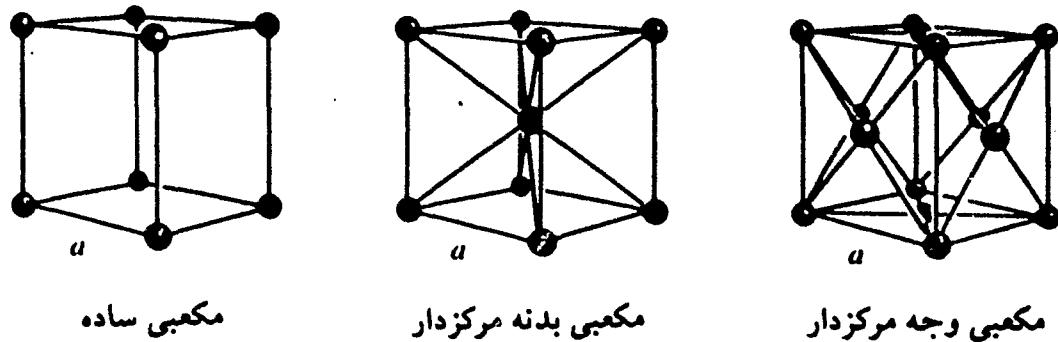
- a ) شبکه مکعبی ساده<sup>۴</sup> که چگالی اتم‌های پایه در آن ۱ می‌باشد. (SC) (شکل ۱-۱-الف)
- b ) شبکه مکعبی بدنی مرکزدار<sup>۵</sup> که چگالی اتم‌های پایه در آن معادل ۲ اتم می‌باشد.
- c ) شبکه مکعبی وجه مرکزدار<sup>۶</sup> که چگالی اتم‌های پایه در آن معادل ۴ اتم می‌باشد.

(شکل ۱-۱-ب) (bcc)  
(شکل ۱-۱-ج) (fcc)

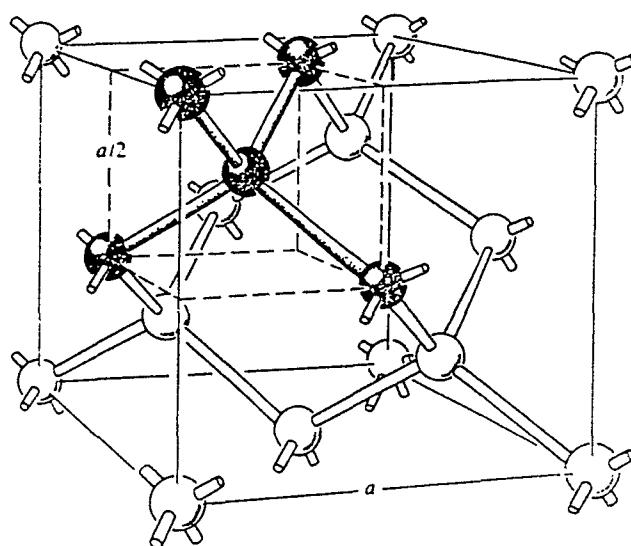
### I) شبکه الماسی:

اما همواره ساختار بلور بوسیله یکی از شبکه‌های براوه توجیه نمی‌شود. بلکه گاهی ساختار شبکه پایه ترکیبی از این شبکه‌های براوه است. مثل شبکه الماسی که ساختار شبکه اغلب نیمه رسانای مهم از جمله Si و Ga است.

- 
- 1. Crystal
  - 2. Polycrystalline
  - 3. A Morph
  - <sup>4</sup>. Simple cubic
  - 5. Body centered cubic
  - 6. Face centered cubic



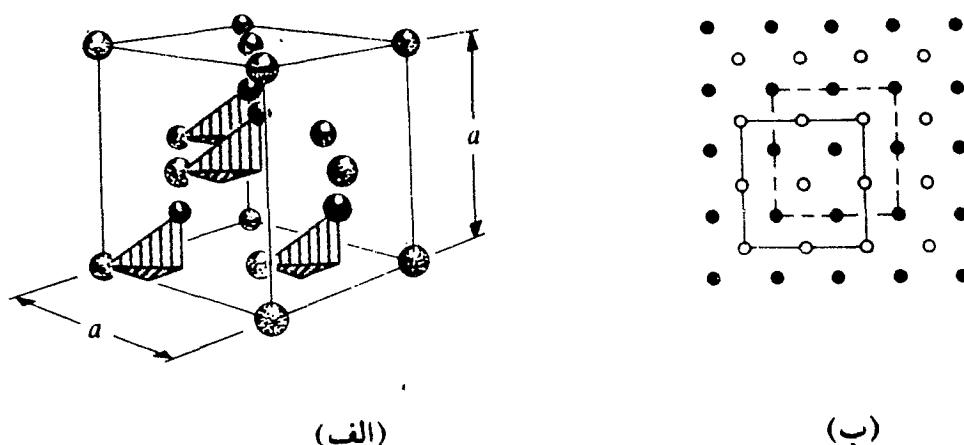
شکل ۱-۱: سلولهایی که برای ۳ نوع ساختار شبکه مکعبی [۱]



شکل ۱-۲: سلول یکّه شبکه الماسی که ساختار چهار نزدیکترین همسایه را نشان می‌دهد. [۱]

شبکه الماسی را می‌توان به شکل یک ساختار fcc در نظر گرفت که یک اتم اضافی در فاصله  $\frac{a}{4} + \frac{b}{4} + \frac{c}{4}$  از هر یک از اتم‌های fcc دارد. به عبارتی یک شبکه الماسی از تداخل دو

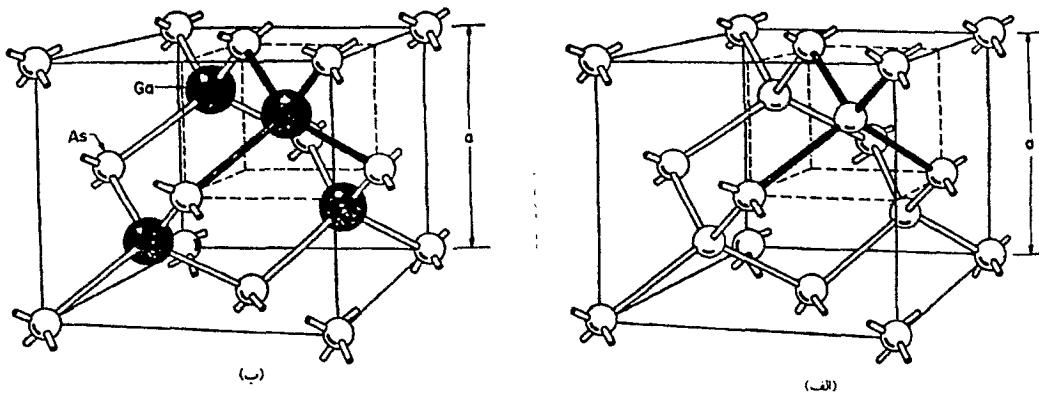
شبکه fcc بوجود آمده، که غیر از fcc اصلی، fcc متداخل دیگری وجود دارد که به اندازه  $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$  نسبت به fcc اصلی در راستای قطر اصلی fcc اصلی جا بجا شده است. شکل (الف - ۱-۳) شبکه الماسی را از بالا (یا با نگاه در راستای  $<100>$ ) نشان می‌دهد و شکل (ب-۱-۳) در شبکه متداخل fcc را بصورت گستردگی نشان می‌دهد که اتم‌های متعلق به fcc اصلی با دایره‌های توخالی نشان داده شده‌اند و شبکه فرعی نفوذکننده دایره‌های توپر هستند.



شکل ۱-۳: ساختار شبکه الماسی: (الف) یک سلوی یکه از شبکه الماسی که با قرار دادن اتم‌هایی در فاصله  $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$  از هر یک از اتم‌ها در fcc ساخته شده است. (ب) نمایی از بالای (در راستای هر  $<100>$ ) یک شبکه الماسی گسترده. دایره‌های توخالی نشان‌دهنده یک شبکه فرعی fcc و دایره‌های توپر نشان‌دهنده fcc نفوذکننده است. [۱]

در این نوع ساختار اگر اتم‌ها همگی مشابه باشند، ساختار را شبکه الماسی می‌نامیم ولی اگر اتم‌ها یک در میان متفاوت باشند، (اول از یک نوع و دوم از اتم دیگر باشد) ساختار

را سولفید روی یا زینک بلند<sup>۱</sup> گویند. که گالیم آرسناید (Ga As) یکی از نیمه رساناهای ترکیبی است که دارای این ساختار می‌باشد. [۱]



شکل ۱-۴: (الف) شبکه الیاسی ب) شبکه زینک بلند [۲]

## II) نیمه رسانا:

نیمه رساناهای گروهی از مواد هستند که رسانایی الکتریکی آنها بین فلزات و عایق‌ها قرار دارد. ویژگی مهم این مواد این است که رسانایی آنها با تغییر دما، برانگیزش نوری و میزان ناخالصی به نحو قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌کند. این قابلیت تغییر خواص الکتریکی، مواد نیمه رسانا را انتخاب مناسبی برای تحقیق در زمینه قطعات الکترونیکی ساخته است.

مواد نیمه رسانا شکل عناصر ستون چهارم جدول تناوبی یا ترکیبی از عناصر ستونهای مجاور آن هستند. به عبارت دیگر نیمه رسانا یا تک عنصری<sup>۲</sup> هستند یعنی از اتم‌های همجنگس

1. Zinc blend

2. elemental

تشکیل شده‌اند یا اینکه علاوه بر این مواد تک عنصری ترکیب اتم‌های ستون سوم و پنجم و نیز

ترکیب‌های خاصی از عناصر ستون دوم و ششم نیمه رساناهای ترکیبی<sup>۱</sup> را می‌دهد.

نیمه‌رساناهای از جمله عناصری هستند که ساختار بلوری دارند و ساختار شبکه برای اغلب

نیمه‌رساناهای مهم (Si و Ga) شبکه الماسی است. البته اتم‌ها در بسیاری از نیمه‌رساناهای

ترکیبی آرایش زنیک بلند دارند.

یادآور می‌شویم که نوع پیوند در این شبکه‌های الماسی از نوع کووالانس است. یعنی هر اتم در شبکه الماسی توسط چهار نزدیکترین همسایه، که هر یک دارای چهار الکترون در مدار

بیرونی است احاطه شده است. به این ترتیب هر اتم الکترونهای ظرفیت خود را با چهار اتم

همساخه تقسیم می‌کند. در ساختار الماسی کووالانسی (شکل ۱-۲) همانند بلورهای یونی

هیچگونه الکترون آزاد در شبکه وجود ندارد. البته نیمه‌رساناهای ترکیبی مانند As Ga دارای

پیوند مختلطی هستند که در آن هر دو نیروی پیوندی یونی و کووالانسی مشارکت دارند.

دقت شود که برای تشکیل یک جامد اتم‌ها طوری گرد هم می‌آیند که ترازهای انرژی .

تقسیم شده اساساً نوارهای پیوسته انرژی را تشکیل می‌دهد و در فاصله بین این نوارهای انرژی

مناطقی قرار دارند که حضور الکترونهای در آنها غیرمجاز است و الکترونی در آن یافت نمی‌شود.

به این مناطق، مناطق ممنوعه گفته می‌شود. پس برخلاف الکترون در خلاء، الکترون در جامد

فقط می‌تواند مقادیر محدودی از انرژی را بپذیرد. هر نوار انرژی مجاز شامل تعداد محدودی

حالت است که می‌توانند تعداد معینی الکترون در خود جای دهند. در نیمه‌رسانه، الکترونهای

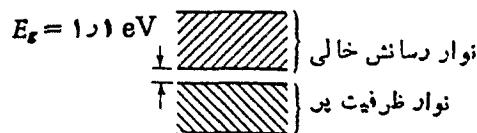
ظرفیت گرد هم می‌آیند تا نواری از ترازهای انرژی موسوم به نوار ظرفیت را اشغال کنند. نوار

انرژی مجاز بعدی موسوم به نوار رسانش، به اندازه گاف ممنوع انرژی Eg از نوار قبلی

---

## 1. Compound

انرژی مجاز بعدی موسوم به نوار رسانش، به اندازه گاف ممنوع انرژی  $E_g$  از نوار قبلی فاصله دارد. این تصویر فیزیکی که نمودار نوار انرژی نامیده می‌شود برای یک نیمه رسانا در شکل (۵) نشان داده شده است.

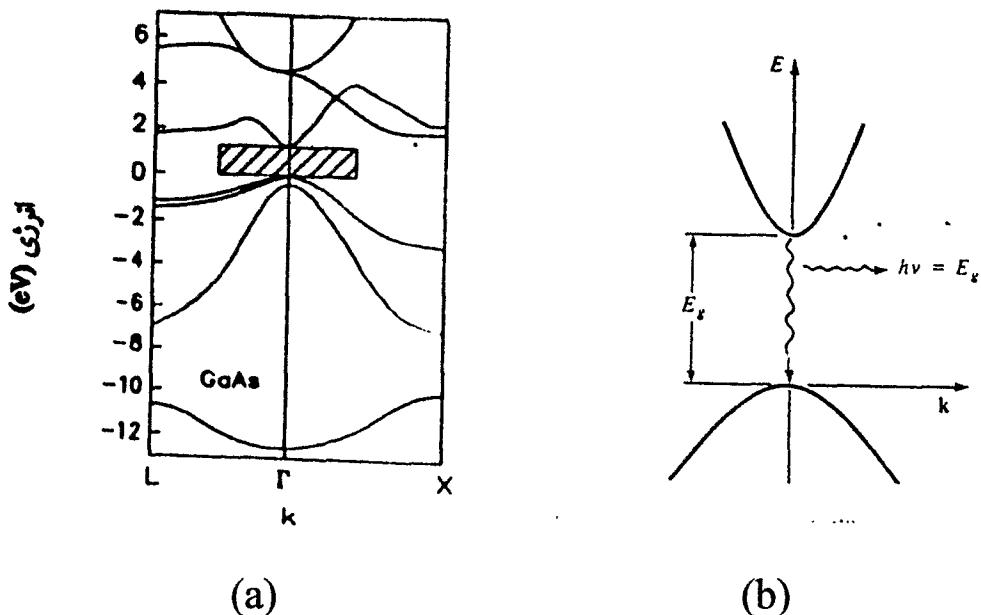


سیلیسیم

شکل ۱-۵: نمودار نوار انرژی برای نیمه رسانا (سلسیم) در  $0K$  که محور قائم انرژی و محور افقی وضعیت فضایی را نشان می‌دهد. [۳]

در یک نیمه رسانا برخلاف عایق‌ها گاف ممنوع انرژی  $E_g$  در حدود  $1\text{ eV}$  است. این امر باعث می‌شود که پیوند الکترونهای ظرفیت چندان محکم نباشد. یعنی در دمای اتاق برخی از الکترونهای ظرفیت ممکن است انرژی گرمایی کافی دریافت کنند تا بر گاف ممنوع غالب آمده و به نوار رسانش برسند. [۳]

متداول است که دو گروه اصلی نیمه رساناهای را که دارای گافهای مستقیم و غیرمستقیم هستند از هم متمایز سازیم. وقتی در فضای  $K$  می‌نیمم نوار رسانایی منطبق با ماکسیم نوار ظرفیت گردد، نیمه رسانا را نیمه رسانای گاف مستقیم می‌گویند. در این مورد می‌توان از ترکیبات  $V$ -III یا  $VI$ -II مانند  $In$ ،  $Sb$ ،  $As$ ،  $Ga$ ،  $As$ ،  $S$  یا  $cd$  را نام برد. در این گذار همانطور که در شکل (۱-۶) دیده می‌شود. فقط تغییر انرژی رخ می‌دهد و عدد موج  $k$  (یا مومنتوم  $p = \hbar k$ ) تغییر نمی‌کند.



شکل ۶-۱: گذار مستقیم a [۱] b [۴]

از جهت دیگر، وقتی می‌نیمم نوار رسانایی در فضای  $k$  منطبق با ماکسیمم نوار ظرفیت نباشد دارای نیم رسانای گاف غیرمستقیم هستیم. عناصر نیمه رسانای Si و Ga مثالهای مهمی از نیمه رساناهای غیرمستقیم هستند. طبق شکل (۶-۱) در این نوع نیمه رساناهای برای رفتن الکترون از نوار هدایت به ظرفیت و برعکس احتیاج به تغییر در عدد موج  $k$  (یا مومنتوم  $\hbar k$ ) دارد. دقت شود که در این نوع نیمه رساناهای گذر از طریق مراکز باز ترکیب یا تله‌ها انجام می‌گیرد. [۴]

هدایت الکتریکی در نیمه رساناهای بر عهده الکترونها و حفره‌های است. در صفحه کلوین نوار ظرفیت در نیمه رساناهای پرونوار هدایت خالی است. با بالا رفتن دما بعضی الکترونها نوار ظرفیت برانگیخته شده و به نوار هدایت می‌جهند. این الکترونها برانگیخته در نوار هدایت نقش مهمی